

		<p>質量分析</p> <p>a 液体注入法 1 試料 1 測定</p> <p>b 熱分解法 //</p> <p>c ヘッドスペース法 //</p> <p>d MS/MS 法による分析の追加 1 試料 1 測定 1 親イオン</p> <p>e 質量スペクトルの解析の追加 1 試料 3 成分まで 1 成分増すごとに</p> <p>(ク) 炭素硫黄分析 1 試料 1 成分</p> <p>(ケ) ラマン分光分析</p> <p>a マッピング測定を行わない場合 1 試料 1 測定</p> <p>b マッピング測定を行う場合 //</p> <p>(コ) エックス線光電子分析 1 試料 1 測定 1 層</p>	
		<p>イ 試料調整 (ア)～(オ) (略) (略)</p> <p>カ) ガスクロマトグラフ質量分析 //</p>	
2	(1) 機械的測定	<p>ア 寸法又は形状の測定</p> <p>(ア) 寸法の測定 1 試料 1 固定 5 箇所まで 1 箇所増すごとに</p> <p>(イ) 点群又は形状曲線の測定 1 固定 30 分まで 30 分増すごとに</p> <p>(ウ) 点群からの寸法算出の追加 1 箇所</p>	
		<p>イ (略) (略)</p>	
		<p>ウ 表面粗さの測定 1 試料 5 箇所まで 1 箇所増すごとに</p>	
		<p>(ク) 炭素硫黄分析 //</p> <p>(ケ) ラマン分光分析 1 試料</p>	
		<p>(コ) エックス線光電子分析 //</p>	
		<p>イ 試料調整 (ア)～(オ) (略) (略)</p>	
2	(1) 機械的測定	<p>ア 寸法測定 1 試料 5 箇所</p> <p>イ 形状測定 1 試料 1 断面</p>	
		<p>ウ (略) (略)</p>	
		<p>エ 表面粗さの測定 1 試料 5 箇所</p>	

	エ (略)	(略)
	オ (略)	(略)
	カ (略)	(略)
	キ (略)	(略)
	ク (略)	(略)
	ケ (略)	(略)
	コ (略)	(略)
	サ (略)	(略)
	シ (略)	(略)
	ス (略)	(略)
(2)	(略)	
電 気 的 測 定	カ 騒音の測定	1測定1時間
(3)	ア 顕微鏡試験 (ア) 走査型電子顕微鏡観察 a 元素分析装置を使用しない場合 b 元素分析装置を使用する場合 (イ)～(オ) (略) (カ) 電界放出形電子顕微鏡観察 a 元素分析装置を使用しない場合 b 元素分析装置を使用する場合 c EBS D解析の追加 d 試料調整 (キ) 顕微鏡による寸法測定	(略) (略) (略) (略) (略) 1試料3視野まで 1試料3視野を超え1視野増すごとに 1試料3視野まで 1試料3視野を超え1視野増すごとに 1時間 1試料1断面 1試料5箇所まで 1試料5箇所を超え1箇所増すごとに
	イ 紫外可視分	1試料5箇所

	オ (略)	(略)
	カ (略)	(略)
	キ (略)	(略)
	ク (略)	(略)
	ケ (略)	(略)
	コ (略)	(略)
	サ (略)	(略)
	シ (略)	(略)
	ス (略)	(略)
	セ (略)	(略)
(2)	(略)	
電 気 的 測 定	カ 騒音の測定	1測定
(3)	ア 顕微鏡試験 (ア) 走査型電子顕微鏡観察 a 分析装置を使用しない場合 b 分析装置を使用する場合 (イ)～(オ) (略)	(略) (略) (略) (略)
	イ 可視分光分	

		光測定	
		ウ 測色計による測色又は色差測定	1 試料 5 箇所
		エ 照度、光沢度、曇度、反射率又は透過率の測定	1 試料 5 箇所
	(4) 熱的測定	(略)	
		イ 熱伝導率	(略)
		ウ 温度の測定 (ア) サーモグラフィによる場合 (イ) その他の場合	<u>1 時間まで</u> <u>1 時間を超え 1 時間増すごとに</u> <u>5 箇所 1 時間まで</u> <u>5 箇所を超え 1 箇所増すごとに</u> <u>1 時間を超え 1 時間増すごとに</u>
		エ 熱応力試験	(略)
		オ 試料調整	1 試料
		3 試験	(1) 強度試験
	(2) 材料性状試験	ア プラスチック又は複合材 (ア)・(イ) (略)	(略)
		ウ (略)	(略)
		イ 窯業材料及び土石類 (ア) 乾燥収縮	<u>1 試料</u>

		析試験又は紫外分光分析試験 (ア) 分光分析試験 (イ) 分光測色試験	1 試料 〃
		ウ 色差計による測色又は色差試験	1 試料
		エ 光沢試験	1 試料
	(4) 熱的測定	(略)	
		イ 熱伝導率 (簡易なもの)	(略)
		ウ 赤外線の放射量 (放射率を含む。)	1 試料
		エ 温度の測定 (ア) サーモグラフィによる場合 (イ) その他の場合	<u>1 試料</u> <u>1 試料 5 箇所まで</u> <u>1 試料 5 箇所を超え 1 箇所増すごとに</u>
		オ 熱応力試験	(略)
		3 試験	(1) 強度試験
	(2) 材料性状試験	ア プラスチック及び複合材 (ア)・(イ) (略)	(略)
		ウ 荷重たわみ温度測定 (エ) (略)	〃 (略)
		イ 窯業材料及び土石類 (ア) 粒度分析 (イ) 乾燥収縮	<u>1 試料</u> 〃

	率試験 (イ) (略) (略) (ウ) (略) (略) (エ) (略) (略) (オ) (略) (略) (カ) (略) (略)	
	(略)	
	エ 繊維 (ア)～(ク) (略)	(略)
	オ 粒度分析	1 試料
	カ 試料調整 (ア) プラスチック又は複合材 (イ) 窯業材料又は土石類	1 試料 〃
	(略)	
(4)	(略)	
電気試験	イ イミュニテ ィ試験又は耐 ノイズ試験 (ア) <u>電波暗室 (登録)を 使用しない 場合</u> (イ) <u>電波暗室 (登録)を 使用する場 合</u>	(略) 〃
(5)	ア 膜厚試験 (ア)・(イ) (略)	(略)
表面処理試験	(略)	
	(略)	
(7)	(略)	
耐食	イ 試験中の試料状態の記録	1 回

	率試験 (ウ) (略) (略) (エ) (略) (略) (オ) (略) (略) (カ) (略) (略) (キ) (略) (略) (ク) 試料調整 〃	
	(略)	
	エ 繊維 (ア)～(ク) (略)	(略)
	(略)	
(4)	(略)	
電気試験	イ イミュニテ ィ試験又は耐 ノイズ試験 (ア) <u>雷サージ イミュニテ ィ試験</u> (イ) <u>その他の 試験</u> a <u>電波暗 室(登録) を使用し ない場合</u> b <u>電波暗 室(登録) を使用す る場合</u>	(略) 〃 〃
(5)	ア 膜厚試験 (ア)・(イ) (略) (ウ) <u>その他の 方法による 試験</u>	(略) 〃
表面処理試験	(略)	
	(略)	
(7)	(略)	
耐食	イ キャス試験	1 試料 1 時間

試験	(略)	
(8) 耐候性試験	(略)	
エ キセノンウエザーメータを使用する場合	1 バッチ 1 時間	
オ カーボンアーク燈光による耐光試験	(略)	
(ア) 照射10時間以下	〃	
(イ) 照射10時間を超え20時間以下	〃	
(ウ) 照射20時間を超え40時間以下	〃	
(エ) 照射40時間を超え100時間以下	〃	
カ 試料調整	1 試料	
(9) 耐久性試験	(略)	
イ 加速寿命試験	1 バッチ 1 時間	
ウ 振動衝撃試験	1 試料 1 時間	
(10) 製品性能試験		
ア (略)	(略)	
イ (略)	(略)	
ウ (略)	(略)	
(11) 測	ロックウェル硬度計	1 台

試験	(略)	
(8) 耐候性試験	(略)	
エ カーボンアーク燈光による耐光試験	(略)	
(ア) 照射10時間以下	1 試料増すごとに 1 試料	
(イ) 照射10時間を超え20時間以下	1 試料増すごとに 1 試料	
(ウ) 照射20時間を超え40時間以下	1 試料増すごとに 1 試料	
(エ) 照射40時間を超え100時間以下	1 試料増すごとに 1 試料	
(9) 耐久性試験	(略)	
イ 加速寿命試験	1 試料 1 時間	
ウ 振動衝撃試験		
(ア) 振動試験	1 試料 1 時間	
(イ) 衝撃試験	〃	
(10) 製品性能試験		
ア スキー及びスノーボード	1 箇所	
(ア) 曲げ弾性試験	〃	
(イ) ビス保持試験	〃	
(ウ) 曲げ疲労試験	〃	
(エ) ねじり強度試験	〃	
(オ) 曲げ破壊強度試験	〃	
(カ) 温度特性試験	1 試料 1 時間	
イ (略)	(略)	
ウ (略)	(略)	
エ (略)	(略)	
(11) 測	マイクロメータ	1 台

定 機 器 試 験				定 機 器 試 験	イ	ダイヤルゲ ージ	1台
					ウ	温度計	1台
					エ	ノギス	1台
					オ	ロックウェ ル硬度計	1台
(略)				(略)			
備考 (略)				備考 (略)			

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。